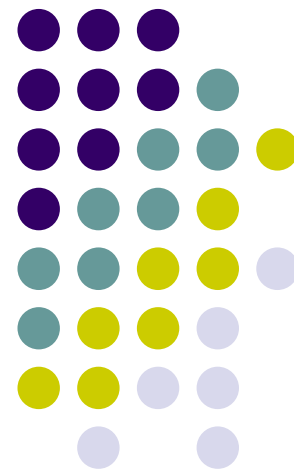


結合機器視覺系統與雷射影像式量測儀 偵測SD Card跳料

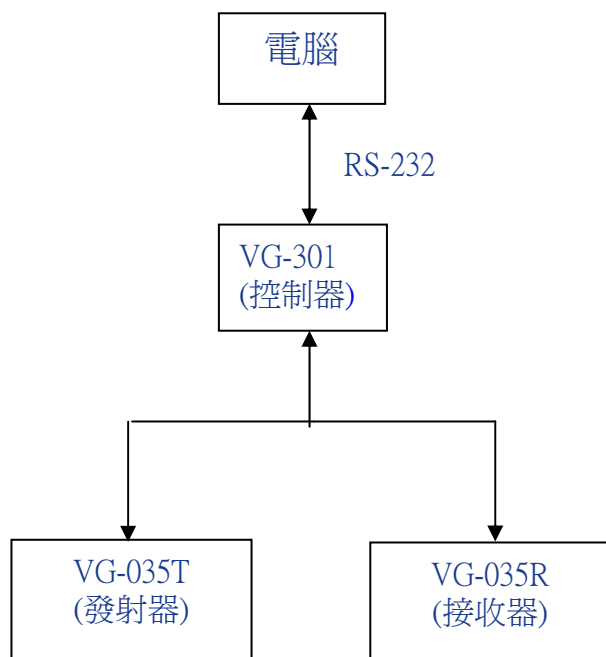
學生：吳嘉河
學號：M9710917
教授：林宸生 老師





硬體架構與量測模式

- 架構



- 模式

- 1、一般模式
→量測外徑及寬度
- 2、亮緣模式
→量測間隙
- ✓ 3、暗緣模式
→邊緣控制與偏量的量測
- 4、區段模式
→量測複雜形狀標的物的位置、尺寸規格與內徑



實驗與應用

- 因自動化設備在進行Tray盤分離或行進時，可能會造成Device的跳料，所以本實驗利用【雷射影像式量測儀】來偵測進料後的Tray盤，是否有SD Card跳料的情形。

實驗儀器



控制器



發射器



接收器

SD Card



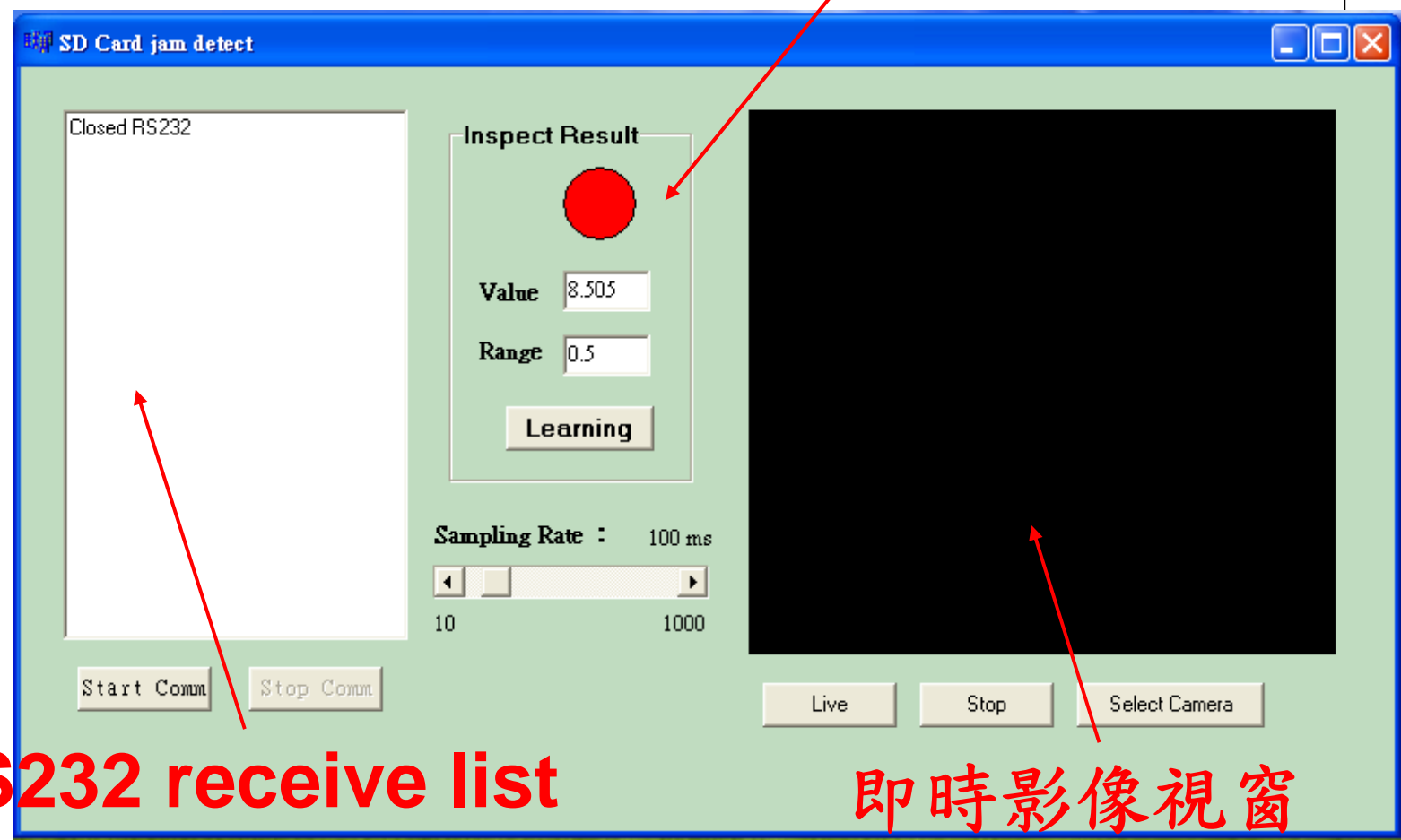
攝影機





軟體功能說明

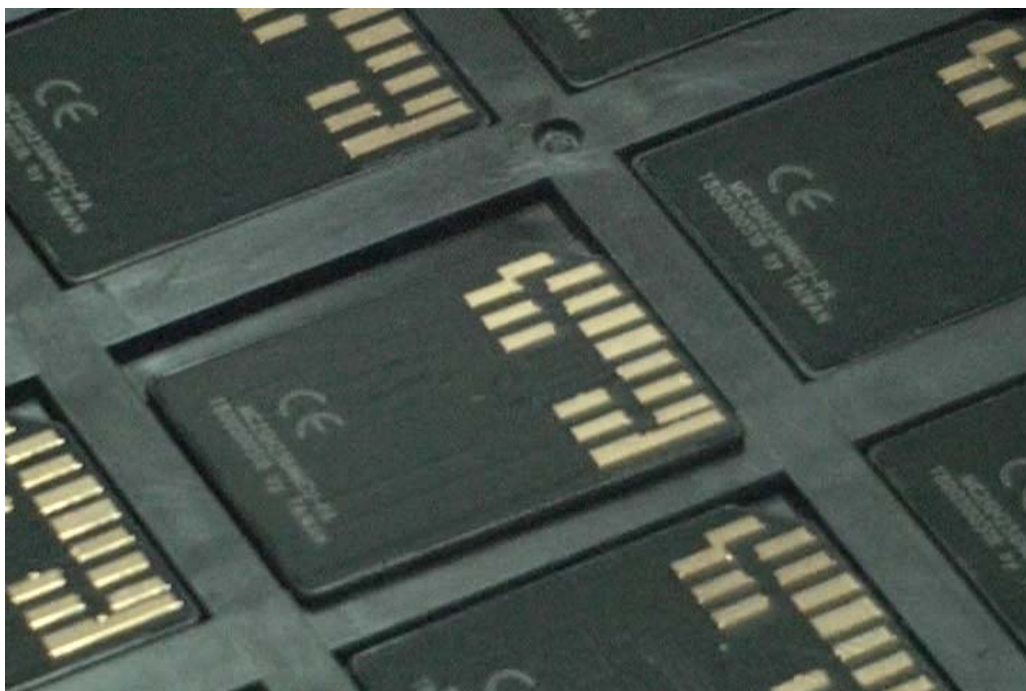
設定與結果



RS232 receive list
(量測儀數據)

即時影像視窗

測試功能



- 模擬跳料
- 啓動RS232
- 開啓即時監視
- 學習閾值
- 設定Range
- Tray盤行進
- 找出跳料



報告結束

Thanks